



MEYER BURGER

High^{LIGHT}组件测试仪

系统认证



High^{LIGHT}阳光模拟仪是梅耶博格组件测试仪系列的最新产品。Pasan SunSim产品的高品质光源已经得到了市场的证明，High^{LIGHT}产品在以前的基础上在电子负载方面有了很大的提升。其精度优于SunSim两倍以上，对于龙背测试法产生动态扫描方式。此外，新的用户友好软件平台可实现通过自动优化测量工艺参数以最大限度地提高High^{LIGHT}设备测量的精确度。

Pasan SA生产的High^{LIGHT}阳光模拟仪已经被中国计量科学研究院 (NIM) 测试和验证。在电子负载的精确度和光源质量评估中，龙背测试法已经被确认。这个特殊测试法是为了高电容性的光伏组件测试而研发的。中国计量科学研究院 (NIM) 证明如下：

Pasan的 High^{LIGHT}电子负载可提供高精度的电流和电压采集结果

NIM测试结果 vs High^{LIGHT}电子负载结果的差异：

- Isc raw: < 0.21%
- Voc raw: < 0.07%

Pasan的High^{LIGHT}光源为A+A+A+高品质光源

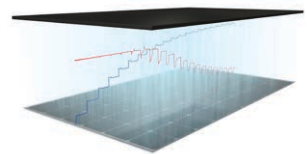
NIM测试结果为：

- 光谱:< +/- 12.5%
- 不均匀性: 0.43%
- LTI (10ms): 0.25%

Pasan龙背测试法

龙背测试法是基于A+级高品质光源的一个适合于高电容组件的测试方法，作为另一种选择的长时稳态光源系统在测试过程中会将组件加热。实验结果显示龙背测试法的最大功率结果和多次正/反态测试结果差异在+/-0.1%以内。

所有的测试已经在中国计量科学研究院 (NIM) 实施。测试时间是2015年1月，地点为北京。且测试结果有文件备份证明。



技术参数若有变化，恕不另行通知 (04/2015)